

BACK-END

THYRISTOR

TRIAC

di/dt TEST SYSTEM 臨界オン電流上昇率試験器

**DIDT1250Z** 1200V  
500A

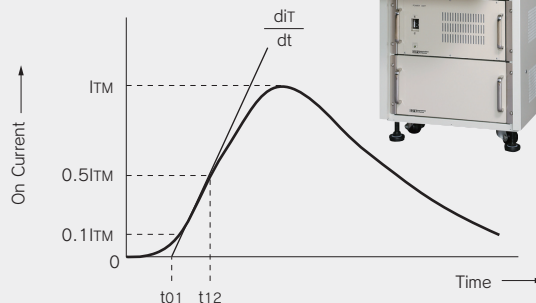
NEW



- DIDT1250Z is the tester for checking whether triac and thyristor can withstand critical on-state current by forcing waveform conforming to the critical rate of rise of on-state current test method (EIAJ ED4521-(4.2.8)). diT/dt can be changed by setting variable coil and VD voltage.
- DIDT1250Zは、EIAJ ED4521-(4.2.8)の臨界オン電流上昇率試験方式に準じた波形を印加し、トライアック及びサイリスタが臨界オン電流率に耐えうるかどうかを確認する試験器です。diT/dtは可変コイルとVD電圧の設定により変更することができます。

MODEL	DIDT1250Z
TEST METHOD	EIAJ ED4521-(4.2.8), JEC-2403-(5.3.2)
MEASURABLE DEVICES	THYRISTOR(SCR), TRIAC(I・II・III・IVモード)
SETTING RANGE	
V <sub>D</sub> VOLTAGE	50V~1200V
I <sub>C</sub> CUT CURRENT	10A~500A
I <sub>C</sub> CUT TIME	0.2μs~25.5μs
I <sub>G</sub> CURRENT	10mA~999mA
GATE PULSE WIDTH	0.2μs~25.5μs
DIMENSIONS & WEIGHT	
MAIN UNIT	550(W)×860(D)+Measuring table×1700(H) …215kg

On Current Waveform



Gate Current Waveform

